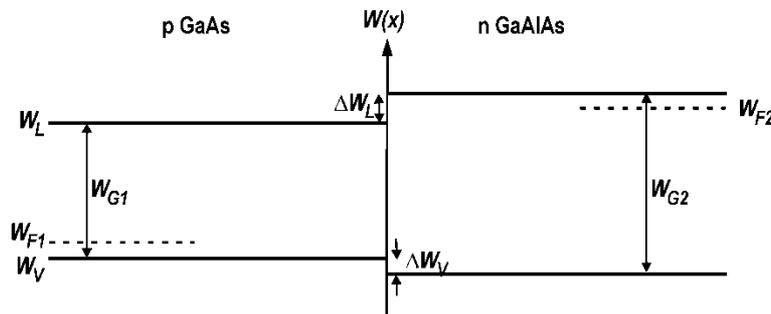


## Musterlösung Übungsblatt 10

### Aufgabe 1) p-n-Laserdiode

Eine p-n-Laserdiode sei als Heterostruktur aufgebaut, d.h. auf der p- und n-Seite werden Materialien mit unterschiedlichen Bandabständen verwendet. Die p-Seite besteht aus GaAs mit einem Bandabstand  $W_{G1} = 1,4 \text{ eV}$ ,  $\epsilon_r = 12,9$  und ist mit einer Akzeptordichte  $n_A = 10^{17} \text{ cm}^{-3}$  dotiert. Die n-Seite besteht aus GaAlAs mit  $W_{G2} = 1,8 \text{ eV}$ ,  $\epsilon_r = 11,5$  und ist mit einer Donatordichte  $n_D = 10^{17} \text{ cm}^{-3}$  dotiert. Im sogenannten Flachbandfall wird eine äußere Spannung so angelegt, dass die Bänder am Übergang nicht verbogen sind, siehe Abb 1.



Figur 1

Die Leitungsbandkante erfährt am abrupten Übergang einen Sprung  $\Delta W_L = 0,26 \text{ eV}$ , die Valenzbandkante einen Sprung  $\Delta W_V = 0,14 \text{ eV}$ . Die Temperatur beträgt  $T = 300 \text{ K}$ . Die äquivalenten Zustandsdichten des Leitungsbandes und Valenzbandes seien für die p-Seite  $N_{L,1} = 4,7 \cdot 10^{17} \text{ cm}^{-3}$  und  $N_{V,1} = 9 \cdot 10^{18} \text{ cm}^{-3}$ ; für die n-Seite betragen die äquivalenten Zustandsdichten  $N_{L,2} = 6,5 \cdot 10^{17} \text{ cm}^{-3}$  und  $N_{V,2} = 1,1 \cdot 10^{19} \text{ cm}^{-3}$ . Es gilt Störstellenerschöpfung.

- a) Skizzieren Sie unter Angabe der entsprechenden Gleichungen die Verläufe der Raumladungsdichte  $\rho(x)$ , des elektrischen Feldes  $E(x)$ , des Potentials  $\varphi(x)$  und die Bandverläufe  $W_{L,V}(x)$  für den Fall, dass keine äußere Spannung angelegt ist. Es gelte die Schottky-Näherung. Beachten Sie beim Skizzieren des elektrischen Feldes die Randbedingung an der Materialgrenzfläche.

#### Lösung:

**Ges.:** Skizze für  $\rho(x)$ ,  $E(x)$ ,  $\varphi(x)$  und das Banddiagramm  $W_{L,V}(x)$

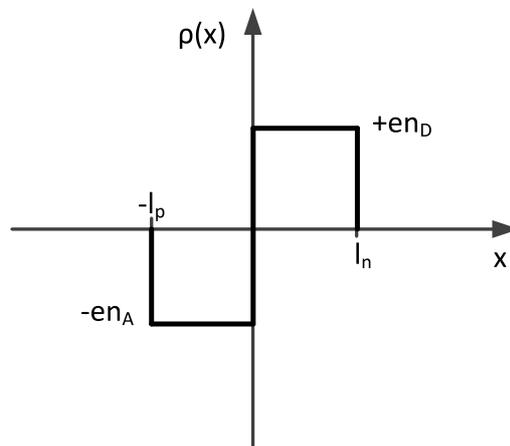
- 1) Raumladungsdichten  $\rho(x)$ :

$$\rho(x) = e[n_D - n(x) - n_A + p(x)]$$

mit der Schottky Näherung

$$n(x) = p(x) = 0 \text{ folgt}$$

$$\rho(x) = \begin{cases} -en_A & -l_p < x < 0 \\ en_D & \text{für } 0 < x < l_n \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$



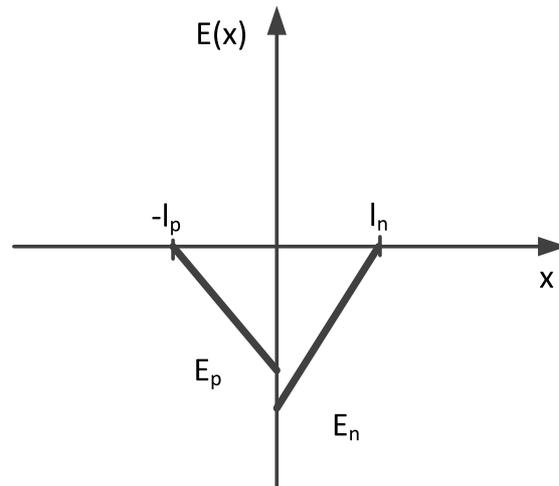
2) **Feldstärke**  $E(x)$ :

$$\operatorname{div} \vec{D} = \rho \rightarrow \frac{d(\varepsilon E)}{dx} = \rho$$

$$\text{bzw. } \varepsilon E = \int \rho dx$$

Die auf p- und n-Seite verschiedenen  $\varepsilon$  ergeben an der Stelle  $x = 0$  einen Sprung im E-Feld:

$$\varepsilon_p E_p = \varepsilon_n E_n \rightarrow E_n = \frac{\varepsilon_p}{\varepsilon_n} E_p$$

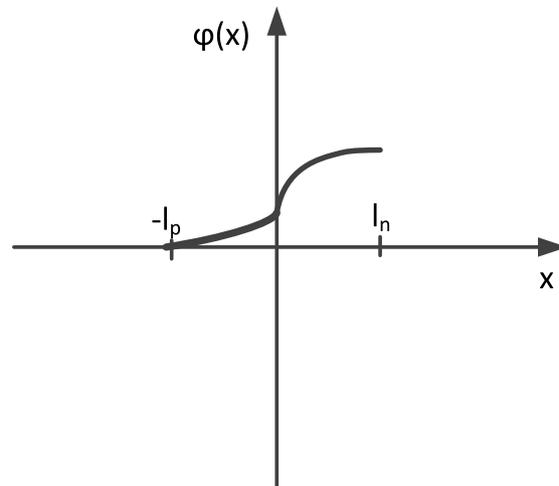


3) **Potential**  $\varphi(x)$ : Der Verlauf folgt

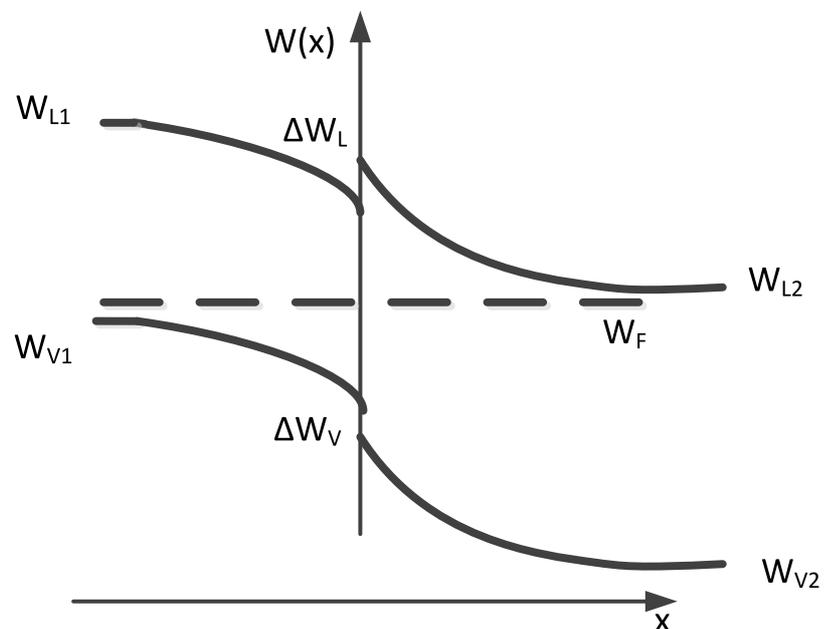
$$\text{mit } \vec{E} = -\operatorname{grad} \varphi \Rightarrow \frac{d\varphi}{dx} = -E$$

$$\text{bzw. } \varphi = -\int E dx$$

Achtung: Die Steigung von  $\varphi$  ändert sich bei  $x = 0$ .



4) Das **Banddiagramm**  $W(x)$  sieht folgendermaßen aus:  $W(x) = W - e\varphi(x)$

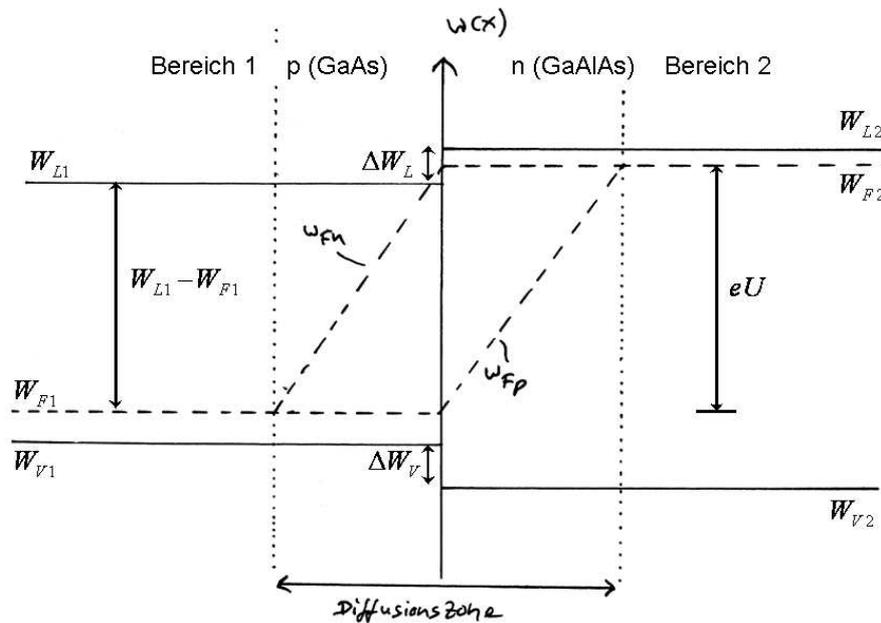


b) Betrachten Sie nun den Flachbandfall und skizzieren Sie den Verlauf der Quasi-Ferminiveaus im p-n-Übergang. Markieren Sie die Raumladungs- und Diffusionsgebiete. Welche Spannung muss an die Diode angelegt werden, damit es zum Flachbandfall kommt? Wo muss der „+“-Pol der Spannung angelegt werden? Liegt in diesem Fall optischer Gewinn vor?

**Ges.:** Skizze für Quasi-Ferminiveaus, die Raumladungs- und Diffusionsgebiete

**Lösung:**

Es gibt im Flachbandfall (ideal) keine Raumladungszonen: Die in der Aufgabenstellung gegebenen Quasi-Ferminiveaus lassen sich nur auf die folgende Art miteinander verbinden (gestrichelt):



Um den Flachbandfall zu erreichen, muss die Diffusionsspannung ausgeglichen werden. Diese ist durch die Differenz der Fermi-Niveaus im p- und n-Halbleiter gegeben, welche sich aus dem Diagramm ablesen lässt:  $eU = W_{F2} - W_{F1}$

1) Zur Berechnung der Spannung wird  $eU = W_{F2} - W_{F1}$  separiert in Differenzen für die Bereiche 1 und 2, in denen die Besetzungskonzentrationen für p (Bereich 1) und n (Bereich 2) bekannt sind.

$$W_{L1} - W_{F1} + \Delta W_L = W_{L2} - W_{F2} + eU \rightarrow U = \frac{W_{L1} - W_{F1} + \Delta W_L - (W_{L2} - W_{F2})}{e}$$

$$= \frac{W_{G1} - (W_{F1} - W_{V1}) + \Delta W_L - (W_{L2} - W_{F2})}{e}$$

2) Für den p-HL (Bereich 1) mit  $W_{L1} - W_{F1} = W_{G1} - (W_{F1} - W_{V1})$  gilt die Verteilung:

$$p = n_A = N_{V1} \exp\left(-\frac{W_{F1} - W_{V1}}{kT}\right) \Rightarrow W_{F1} - W_{V1} = -kT \ln\left(\frac{n_A}{N_{V1}}\right) = 116,3 \text{ meV}$$

3) Für den n-HL (Bereich 2) mit  $W_{L2} - W_{F2}$  gilt die Verteilung:

$$n = n_D = N_{L2} \exp\left(-\frac{W_{L2} - W_{F2}}{kT}\right) \Rightarrow W_{L2} - W_{F2} = -kT \ln\left(\frac{n_D}{N_{L2}}\right) = 48,4 \text{ meV}$$

Einsetzen dieser Differenzen in die Ausgangsgleichung unter 1) ergibt:

$$U = \frac{W_{G1} + kT \ln\left(\frac{n_A}{N_{V1}}\right) + \Delta W_L + kT \ln\left(\frac{n_D}{N_{L2}}\right)}{e} = 1,495 \text{ V}$$

Optischer Gewinn liegt vor, wenn die Separation der Quasi-Ferminiveaus größer als der Bandabstand ist und wenn mindestens ein Quasi-Ferminiveau im Band liegt.

Für den p-Halbleiter liegt das Quasi-Ferminiveau für Elektronen am Rande des pn-Übergangs im Leitungsband. Die Separation der Quasi-Ferminiveaus ist dort größer als der Bandabstand  $W_{G1} = 1,4 \text{ eV} < 1,495 \text{ eV}$ , so dass optischer Gewinn vorliegt.

- c) Berechnen Sie die maximale Feldstärke  $E_{max}$  in der Diode, wenn keine äußere Spannung angelegt ist. Beachten Sie dabei, dass die in b) berechnete „Flachbandspannung“ gerade der Diffusionsspannung der Diode entspricht.

**Ges.:**  $E_{max}$ , für  $U = 0 \text{ V}$ .

Lösung:

1) Das  $E$ -Feld springt bei  $x = 0$  um  $\epsilon_p E_p = \epsilon_n E_n$ ,  $E_p = \frac{\epsilon_n}{\epsilon_p} E_n$

2) Mit den Zeichnungen und Gleichungen aus a) folgt:  $E_p = -e n_A l_p / \epsilon_p$  und

$$E_n = -e n_D l_n / \epsilon_0 \epsilon_n$$

(Flächeninhalte der Rechtecke in der  $\rho(x)$ -Verteilung).

3) Für das Potential gilt allgemein:  $\phi = -\int E dx$ :  $\phi_{ges} = -\frac{1}{2} E_p l_p - \frac{1}{2} E_n l_n$ ,

(Flächeninhalte der Dreiecke in der  $E(x)$ -Verteilung)

4) Wegen Ladungsneutralität gilt mit Gl. (6.28) und (6.29):  $l_p = l_n n_D / n_A$

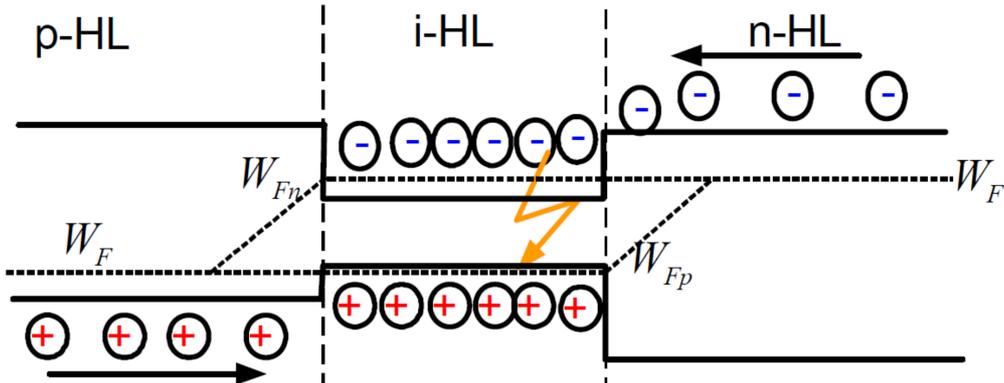
5) Einsetzen von 1) und 4) in 3) und ersetzen von  $l_n$  mittels 2):

$$\phi_{ges} = -\frac{1}{2} \frac{\epsilon_n}{\epsilon_p} E_n l_n \frac{n_D}{n_A} - \frac{1}{2} E_n l_n \rightarrow \phi_{ges} = \frac{1}{2} \frac{(\epsilon_0 \epsilon_n)^2}{e} E_n^2 \left( \frac{1}{n_A \epsilon_0 \epsilon_p} + \frac{1}{n_D \epsilon_0 \epsilon_n} \right)$$

Dies entspricht der Spannung  $U = 1.495 \text{ V}$  des Flachbandfalls **(b)**.

Die maximale Feldstärke beträgt somit:  $E_{max} = |E_n| = \sqrt{\frac{2e\phi_{ges}}{(\epsilon_0 \epsilon_n)^2 \left( \frac{1}{n_A \epsilon_0 \epsilon_p} + \frac{1}{n_D \epsilon_0 \epsilon_n} \right)}} = 156.9 \frac{\text{kV}}{\text{cm}}$

- d) Technische Realisierungen von Halbleiterlasern beruhen fast ausschließlich auf Doppel-Heterostrukturen. Skizzieren Sie qualitativ den Bandverlauf einer Doppel-Heterostruktur im Flachbandfall und erläutern Sie die Vorteile gegenüber einer einfachen Heterostruktur.



Vorteile Doppelheterostruktur:

- Ladungsträgerinjektion in Potentialkästen
- Potentialbarrieren verhindern Diffusion der Träger aus dem aktiven Bereich
- Effiziente Lichterzeugung im gesamten intrinsischen Bereich
- Lichtleitung im intrinsischen Bereich möglich, wenn Brechungsindizes  $n_{\text{int}} > n_p$  und  $n_{\text{int}} > n_n$

### Aufgabe 2) Ersatzschaltbild einer pn-Diode

Eine p-n-Diode wird wie abgebildet in Vorwärtsrichtung betrieben. Entnehmen Sie die Werte für Spannungen, Ströme und Widerstände aus Abb. 2.

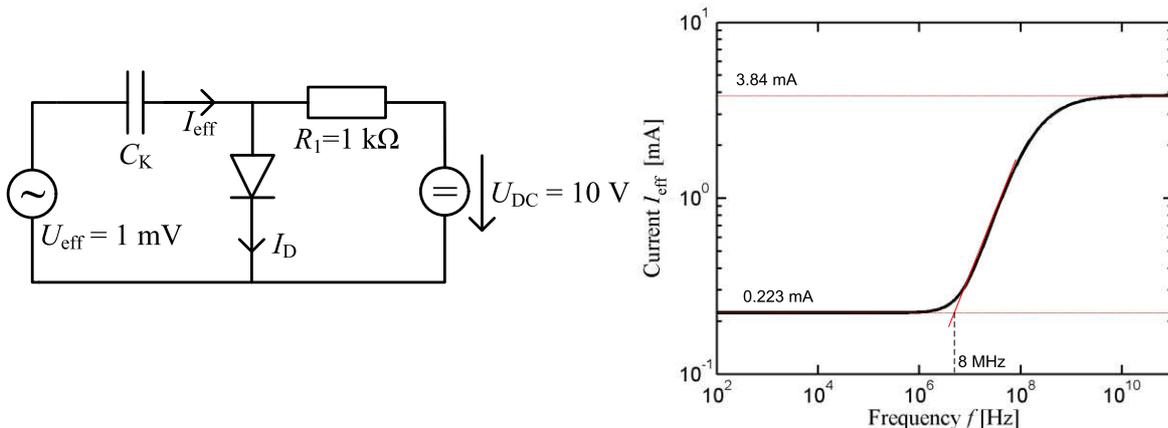
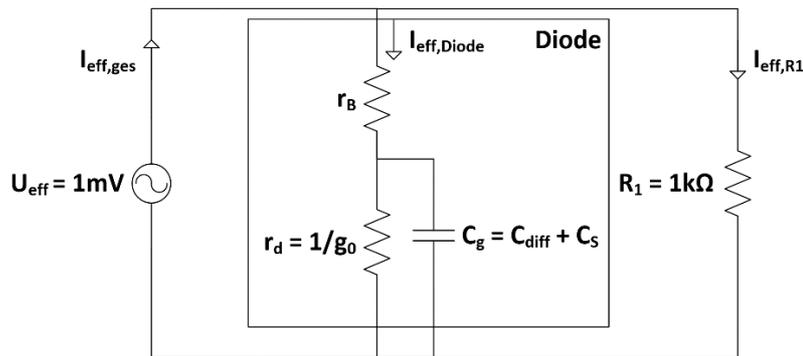


Fig. 1: Diode mit äußerer Beschaltung (links), Frequenzgang des Gesamtstroms (rechts). Die Frequenz, bei welcher der Strom um einen Faktor  $\sqrt{2}$  angestiegen ist, liegt bei 8 MHz.

a) Zeichnen Sie die zugehörige Kleinsignal-Ersatzschaltung. Berücksichtigen Sie dabei den Bahnwiderstand  $R_b$  der Diode und fassen Sie die Sperrschichtkapazität und die Diffusionskapazität zu einer Gesamtkapazität  $C_g$  zusammen. Behandeln Sie die Kapazität  $C_K$  für alle betrachteten Frequenzen als Kurzschluss.

**Lsg:** Wird  $C_K$  durch einen Kurzschluss ersetzt und der Serien-Bahnwiderstand berücksichtigt, resultiert die Kleinsignalerersatzschaltung zu:



b) Bestimmen Sie die Elemente der Kleinsignal-Ersatzschaltung der Diode (Bahnwiderstand, Kleinsignal-Leitwert, Gesamtkapazität) mit Hilfe des rechts skizzierten Frequenzganges des Effektivwerts  $I_{eff}$  des Kleinsignal-Wechselstroms. Nutzen Sie dabei die Tatsache, dass der Bahnwiderstand der Diode sehr klein ist im Vergleich zu den anderen Widerständen.

**Lsg:**

Der effektive Strom der durch den Widerstand  $R_1$  fließt, ergibt sich zu  $I_{eff} = \frac{U_{eff}}{R_1} = \frac{1mV}{1k\Omega} = 1\mu A$ .

Bei geringen Frequenzen fließt also der Strom  $I_{eff,Diode} = I_{eff,ges} - I_{eff,R1} = 222\mu A$  durch die Reihenschaltung von  $r_B$  und  $r_d = 1/g_0$  (näherungsweise fließt also kein Strom durch die Kapazität).

Daraus lässt sich nun der Gesamtwiderstand der Diode berechnen zu

$$r_b + r_d = \frac{U_{eff}}{I_{eff,ges(1)} - \frac{U_{eff}}{R_1}} = \frac{1mV}{222\mu A} = 4.5\Omega$$

Bei hohen Frequenzen wird  $r_d$  durch  $C_g$  kurzgeschlossen. Durch  $r_b$  fließt nun der Strom

$$I_{eff,Diode} = 3.84mA, \text{ sodass gilt: } r_b = \frac{U_{eff}}{I_{eff,ges(2)} - \frac{U_{eff}}{R_1}} = \frac{1mV}{3.84mA} = 0.26\Omega$$

Damit lässt sich der differentielle Widerstand  $r_d$  berechnen zu  $r_d = 4.24\Omega$ .

Aus dem Frequenzgang des Gesamtstroms lässt sich herauslesen, dass der Strom bei 8 MHz um einen Faktor  $\sqrt{2}$  ansteigt. Dies bedeutet, dass bei der Grenzfrequenz von 8 MHz  $\omega C_g = g_0$ ,

$$\text{bzw. } C_g = \frac{1}{2\pi \cdot 4.24\Omega \cdot 8 \cdot 10^6 \text{ Hz}} = 4.69nF \text{ ist.}$$